

Исследование причины отслоения сегнетоэлектрических пленок PZt от подложки методом электронной оже-спектроскопии	3
<i>В. Г. Бешенков, А. Г. Знаменский, В. А. Марченко</i>	
Формирование островковых пленок алюминия при электронном облучении поверхности сапфира	7
<i>Е. Ю. Зыкова, А. А. Хайдаров, И. П. Иваненко, И. К. Гайнуллин</i>	
Исследование формирования электронной структуры металлоуглеродных наноструктур	12
<i>И. Н. Шабанова, Н. С. Терехова</i>	
Исследование электрических и оптических свойств полупроводниковых структур с высоким пространственным разрешением методами РЭМ	18
<i>Е. Б. Якимов</i>	
Влияние облучения электронным пучком в РЭМ на катодолюминесценцию и наведенный ток в InGaN/GaN светодиодах с заглубленной активной областью	22
<i>П. С. Вергелес, Н. М. Шмидт, Е. Б. Якимов</i>	
Сравнение контраста дислокаций и границ зерен в методах ХВЭС и наведенного тока	27
<i>Я. Л. Шабельникова, Е. Б. Якимов</i>	
Влияние загрязнения железом на контраст протяженных дефектов в мультикристаллическом кремнии в режиме наведенного тока	31
<i>О. В. Феклисова, Х. Ю. Д. Янг, Е. Б. Якимов</i>	
Двумерная диффузия и катодолюминесценция экситонов, генерированных электронным пучком в полупроводниковом материале: результаты математического моделирования	35
<i>А. Н. Поляков, M. Noltemeyer, T. Hempel, J. Christen, M. A. Стенович</i>	
Исследование эмиссионных систем с покрытием методами натурского и математического моделирования на примере W–Cs ₃ Sb	41
<i>Н. В. Егоров, Л. И. Антонова, А. Ю. Антонов</i>	
Контраст изображений локально заряженных диэлектриков в растровой электронной микроскопии	47
<i>Э. И. Рау, А. А. Татаринцев</i>	
Внутренняя эмиссия горячих электронов на поверхности металла в реакционных атомных столкновениях: нанодиод Шоттки Pd/n-Si	55
<i>В. В. Стыров, С. В. Симченко</i>	
Качественные и количественные отличия спектров поглощения облученных электронами отражающих покрытий на основе смесей BaTiO ₃ с микро- или нанопорошком ZrO ₂ различной концентрации	61
<i>М. М. Михайлов, Т. А. Утебеков</i>	
Термостимулированные поверхностные сегрегационные процессы в ионных кристаллах: хлорид натрия	69
<i>Ю. Я. Томашпольский, Н. В. Садовская, Н. В. Козлова, Г. А. Григорьева</i>	
Оценка размеров микроблоков в мозаичных кристаллах по характеристикам излучения быстрых электронов	78
<i>Д. А. Бакланов, И. Е. Внуков, С. А. Лактионова, Р. А. Шатохин</i>	